INFORMATION
SCIENCE
TECHNICAL
REPORT

NAIST-IS-TR2010004
ISSN 0919-9527

Enhanced Functional Fault Model for Micro Operation Faults

Chia Yee Ooi, Hideo Fujiwara

July 2010

NAIST

〒630-0192
奈良県生駒市高山町 8916-5
奈良先端科学技術大学院大学
情報科学研究科

Graduate School of Information Science
Nara Institute of Science and Technology
8916-5 Takayama, Ikoma, Nara 630-0192, Japan